

## Deutsche Akkreditierungsstelle

### Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12061-01-03 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab:** 20.12.2023

Ausstellungsdatum: 20.12.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-12061-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH**  
**Merianstraße 28, 63069 Offenbach**

mit dem Standort

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH**  
**Merianstraße 28, 63069 Offenbach (Standort A)**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

**Cyber Security für industrielle Automatisierungssysteme**

*Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen ([www.dakks.de](http://www.dakks.de))*

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12061-01-03**

Es wird folgendes Prüfverfahren für die Cyber Security von Objekten, Komponenten, Geräten und Einrichtungen der Informationstechnik, Informations-Verarbeitungssysteme und Software angewendet:

TL43 0230-1, Version 1, VDE Prüfverfahren – Informationssicherheit IEC 62443-4-2  
2020-07-10

**Dieses Prüfverfahren basiert auf der im Folgenden genannten Norm:**

IEC 62443-4-2:2019 Industrielle Kommunikationsnetze – IT-Sicherheit für Netze und Systeme  
Teil 4-2: Technische Sicherheitsanforderungen für IACS-Komponente